

第 22 回高温エレクトロニクス研究会

ーデバイス故障診断ー

2012年3月21日(水) 13:30-17:30
JAXA 宇宙科学研究所 相模原キャンパスA棟2階大会議室
* 事前登録不要・参加費無料

第22回高温エレクトロニクス研究会を JAXA 宇宙科学研究所相模原キャンパスにて開催いたします。
皆様の参加をお待ちしております。

プログラム

(敬称略, 各講演質疑応答含めて 35 分)

■13:30-13:35

「はじめに」 廣瀬和之 (宇宙研)

<故障箇所特定>

■13:35-14:10

「レーザ微小領域電界センサーを用いた故障解析」 伊藤誠吾, 滝口清昭 (東大生研)

■14:10-14:45

「テラヘルツ波放射を用いた集積回路診断法の開発 - LSI の故障箇所が見える方法 -」
山下将嗣 (理研)

■14:45-15:20

「電磁場再構成機能を備えた磁気イメージング装置の開発と電子部品故障解析への応用」
木村建次郎, 美馬勇輝 (神戸大) 木村恵明 (阪大) 大藪範昭 (京大) 稲男健 (村田製作所)

15:20-15:45 休憩

<故障現象解析>

■15:45-16:20

「レーザボルテージプローブ・ダイナミック診断 Meridian 紹介」 茂木忍 (DCG システムズ)

■16:20-16:55

「高耐圧パワー MOSFET の故障解析における課題」 大井明彦 (富士電機)

■16:55-17:30

「プリント基板と実装部品の解析サービス&フォトエミッション顕微鏡」
丹野雅明 (豊通エレクトロニクス)

本年度のテーマ

電子デバイスを高温環境で使用すると、さまざまな故障が起きることがあります。故障箇所を特定して故障現象を明らかにすることは、故障原因を究明して対策をたてるために不可欠なことです。本年度はそのような「デバイス故障診断」に焦点を当てました。この分野の第一線の方々に、最新の故障解析技術やデバイス故障解析の考え方について幅広くご講演をいただきます。皆様奮ってご参加下さい。

高温エレクトロニクス研究会とは

高温エレクトロニクス関連分野は、宇宙をはじめとして、パワーデバイス、カーエレクトロニクス、資源探査、原子力等の広い領域に渡ります。本研究会は、このような高温エレクトロニクスのシステム・デバイス・材料に関する技術の現状を把握するとともに、その新しい応用分野を開拓することを目的として、広い層の研究者・技術者相互の交流を促進するよう、毎年開催されています。

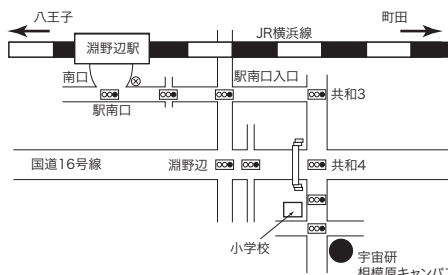
■事前登録 / 参加費

事前登録は不要です。また、参加費は無料です。

■問い合わせ先

JAXA 宇宙科学研究所 宇宙探査工学研究系
准教授 廣瀬和之, 助教 小林大輔
〒252-5210 神奈川県相模原市中央区由野台 3-1-1
050-3362-3126 hte@isas.jaxa.jp

■最寄り駅から相模原キャンパスまでのご案内



JR 横浜線 湘野辺駅
南口より徒歩 20 分

会場 (A 棟) は
入り口正面の建物に
なります